DIN 54185:2021-06 (D)

Zerstörungsfreie Prüfung - Thermografische Prüfung - Lock-in-Thermografie mit optischer Anregung

Inhalt		Seite	
Vorwort4			
1	Anwendungsbereich	5	
2	Normative Verweisungen	5	
3	Begriffe	6	
4	Personalqualifikation	7	
5	Funktionsweise der Lock-in-Thermografie und Geräteaufbau	7	
5.1	Allgemeines und Gesamtaufbau	7	
5.2	Optische Anregungsquellen für die Lock-in-Thermografie		
5.2.1	Allgemeines		
5.2.2	Anregungsform		
5.2.3	Halogenlampen		
5.2.4	LED-Arrays		
5.2.5	Laser und Laserarrays		
5.3	IR-Kameras		
5.4 5.5	Offline Lock-in-Thermografie		
5.5 5.6	Online Lock-in-ThermografieProbenpositionierung		
5.6 5.7	Arbeitsschutz		
6	Festlegung und Überprüfung der Kennwerte		
6.1	Referenzprobekörper		
6.2	Thermische Diffusionslänge		
6.3	Örtliche Auflösung		
6.4	Nachweisempfindlichkeit		
6.5	Homogenität der Anregung		
7	Vorbereitung der Prüfung	19	
8	Durchführung der Prüfung	20	
9	Datenauswertung	21	
9.1	Berechnung der Amplituden- und Phasenbilder bei der Lock-in-Thermografie		
9.2	Detektion von Fehlstellen in Amplituden- und Phasenbildern		
9.2.1	Bestimmung des Amplituden- und Phasenkontrastes von Fehlstellen	21	
9.2.2	Bestimmung des CNR von Fehlstellen		
9.3	Schichtdickenmessung und Bestimmung der Überdeckung von Fehlstellen		
9.4	Bestimmung der lateralen Größe von Fehlstellen	23	
10	Prüfbericht	23	
Anhar	ng A (informativ) Analytische Lösung der eindimensionalen Wärmeleitungsgleichung für	~-	
	Schichten [2]		
Anhar	ng B (informativ) Muster-Prüfbericht	27	
Litera	turhinweise	29	

Bilder

Bild 1 — Abhängigkeit der relativen Ausgangsleistung von Halogenlampen und LED-Arrays von der Anregungsfrequenz	11
Bild 2 — Thermische Diffusionslänge in verschiedenen Materialien in Abhängigkeit von der Anregungsfrequenz	11
Bild 3 — Abhängigkeit der Amplitude (a) und Phase (b) der Prüfobjekttiefe in Stahl ($\alpha = 0.066 \text{ cm}^2/\text{s}$) für verschiedene Anregungsfrequenzen	17
Bild A.1 — Vielfachreflexionen in einer Schicht der Dicke d zwischen Luft und Substrat [4]	25
Tabellen	
Tabelle 1 — Anforderungen an und Eigenschaften von Messungen in Reflexionskonfiguration mit Lock-in-Thermografie	8
Tabelle 2 — Eigenschaften der verschiedenen Anregungsquellen	12